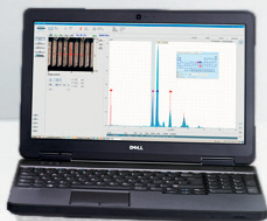




Настольный микро-РФА спектрометр

M1 MISTRAL



M1 MISTRAL

- ✓ Это настольный спектрометр для анализа изделий и толщин покрытий с использованием метода рентгеновской флуоресценции (РФА).
- ✓ Спектрометр позволяет проводить неразрушающий контроль в широком диапазоне размеров образцов без специальной подготовки
- ✓ Области применения включают электронику, ювелирные изделия, машиностроение, автомобилестроение и т.д.
- ✓ Метод РФА позволяет исследовать широкий спектр различных материалов, таких как металлы, сплавы и металлические слои, в том числе многослойные системы
- ✓ Образцы размером до 100x100x100 мм могут быть помещены непосредственно на предметный столик и измерены без дополнительной подготовки
- ✓ Полная моторизация стола по осям ХУ и автоматический фокус по оси Z обеспечивает точное позиционирование на выбранном месте абзаца

АНАЛИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

- ✓ Желтое золото
- ✓ Белое золото
- ✓ Сплавы платины
- ✓ Сплавы серебра

RoHS- КОНТРОЛЬ

- ✓ Концентрация Pb, Hg, Cr⁶, Br (PBB и PBDE) должна быть <1000 ppm
- ✓ Концентрация Cd должна быть <100 ppm

ИЗМЕРЕНИЕ ТОЛЩИН ПОКРЫТИЙ

Можно проанализировать различные системы слоев по толщине и составу, например:

- ✓ Zn/Fe
- ✓ Au/Ni/Cu
- ✓ Au/Pd/Ni/Cu
- ✓ CuSn/Ni/Cu
- ✓ Cr/Ni/Cu
- ✓ Ni-P/Al

АНАЛИЗ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ДРАГОЦЕННЫХ СПЛАВОВ

M1 MISTRAL идеально подходит для анализа ювелирных изделий, монет или сплавов драгоценных металлов в целом. Точный состав всех ювелирных сплавов, металлов платиновой группы или серебра можно определить за доли минуты. Результаты могут быть представлены в процентах массовой доли или в пробе золота.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПО RoHS

M1 MISTRAL хорошо подходит для контроля безопасности материалов на наличие вредных примесей.

Спектрометр может анализировать следовые количества тяжелых металлов в электронных компонентах, пластмассах, сплавах и многих других материалах для обеспечения соответствия стандарту RoHS.

ИЗМЕРЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЙ

Технология РФА, используя в M1 MISTRAL, позволяет эффективно измерять толщину покрытий, например, на печатных платах, металлах или пластмассах. Система поддерживает исследование одно- и многослойных покрытий. Программа одновременно рассчитывает толщину слоя, а также его состав, используя нестандартный метод или специальные калибровки на основе стандартных образцов.

КОНТАКТЫ



СКР-STANKIN.RU



STANKIN.RU



8 (499) 973 3989



127055 МОСКВА,
ВАДКОВСКИЙ ПЕР., Д.1